

研究タイトル:

## うず電流変位計・うず電流非破壊検査



氏名: 石田 浩一 / ISHIDA Koichi E-mail: isida@tokuyama.ac.jp

職名: 講師 学位: 博士(工学)

所属学会・協会: 応用物理学会、中国四国工学教育協会

キーワード: 光情報処理

技術相談

提供可能技術:

- ・非破壊検査に関する問題
- ・STM
- ・

研究内容:

☆STMは次世代の先端技術となる！

STM(Scanning Tunneling Microscope)は非接触で原子レベルの構造が観察できる。  
マイクロオーダーでの加工が可能で、現在ナノオーダーでの加工技術を検討中です。

☆ホログラム(3次元の映像を映し出す写真のようなもの)

ホログラムとコンピューターとどのように結びつけて行くか、その際障害となるノイズ除去対策をどうするかを検討しています。

(開発速度が速く、ついていけない部分もあるが)

☆ うず電流による非破壊検査における速度効果の研究

(用途; 渦流探傷検査装置、メッキ厚さの均質性測定など)

提供可能な設備・機器:

名称・型番(メーカー)

名称・型番(メーカー)	